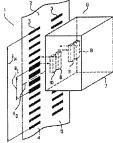
METHOD FOR PRODUCING SHAFT INFORMATION DATA OF ELEVATOR SHAFT AND DEVICE FOR CONDUCTING METHOD THEREOF

Also published as: Publication number: JP8225269 (A) Publication date: 1996-09-03 JP3888474 (B2) Inventor(s): BERUNHARUDO GERUSUTENKORUN P0722903 (A1) Applicant(s): INVENTIO AG T EP0722903 (B1) Classification: 7A9600443 (A) - international: B66B3/02; B66B1/34; B66B3/02; B66B1/34; (IPC1-TQ US5821477 (A) 7): B66B3/02 more >>

- European: B66B1/34F Application number: JP19960007896 19960119 Priority number(*): CH19950000153 19950120

Abstract of JP 8225269 (A) PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method and a device for improving the reliability of shaft information, SOLUTION: A reflection plate 2 denoted by a code 3 is disposed in the area of a stopping place. The code 3 indicates two similar tracks 4 and 5. The code 3 of the tracks 4 and 5 is detected, and evaluated by a 2-channel evaluator 7 arranged in an elevator car 6. The optical transmitters 8 and 9 of the evaluator 7 illuminate the tracks 4 and 5 of the reflection plate 2. Images on the illuminated surfaces of the tracks 4 and 5 are formed on the surfaces of the charge-coupled device sensors 10 and 11 of the evaluator 7, and detected by a pattern recognition logical device. The generation of information used for elevator control by the processing of these images is carried out by a computer



Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出職公開番号

特開平8-225269

(43)公開日 平成8年(1996)9月3日

Company and the company of	with the second or a					
(51) Int.Cl.4	識別記号	广内整理番号	F 1			技術表示箇所
B66B 3/02			B66B	3/02	Q	
					37	

審査請求 未請求 請求項の数8 OL (全 7 頁)

(21)出願番号	特職平8-7896	(71)出職人 390040729
		インベンテイオ・アクテイエンゲゼルシヤ
(22)出順日	平成8年(1996)1月19日	フト
		INVENTIO AKTIENGESE
(31)優先権主整番号	00 153/95-1	LLSCHAFT
(32)優先日	1995年 1 月20日	スイス国、ツエーハー-6052・ヘルギスピ
(33)優先権主張国	スイス (CH)	ル、ゼーシュトラーセ・55
		(72)発明者 ベルンハルド・ゲルステンコルン
		スイス国、ツエーハー-6036・デイエリコ
		ン、クリヒルゼル・10
		(74)代理人 弁理士 川口 義雄 (外2名)

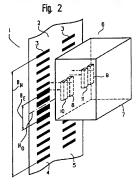
(54) 【発明の名称】 エレベータ・シャフトのシャフト情報データを発生する方法およびこの方法を実施する装置

(57)【要約】

【課題】 シャフト情報の信頼性を向上する方法及び装 置を提供する。

【解決手段】 符号 (3) を有する反射板 (2) が停止 場所の領域に配置される。符号(3)は2つの同一のト ラック (4、5) を示す。トラック (4、5) の符号 (3) が検出され、エレベータ・ケージ(6) の所に配 置されている2チャンネルの評価器(7)によって評価 される。評価器 (7) の送光器 (8、9) が反射板 (2) のトラック(4、5) を照明する。トラック

(4.5)の照明された表面の像が評価器 (7)の電荷 結合素子センサ(10、11)の表面に結び、パターン 認識論理装置によって検出される。それらの画像の処理 によるエレベータ制御に使用される情報の生成がコンピ ユータによって行われる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 エレベータ・シャフト(1)の内部を動 くことができるエレベータ・ケージ(6)と、エレベー タ・シャフト(1)の内部に配置されている読取り可能 た符号(3)とを有するエレベータ・シャフト(1) の、エレベータを制御するシャフト情報データを発生す る方法において、符号(3)を画像ごとに読取り、読取 った符号(3)の画像に含まれている少なくとも1つの パターンを認識し、認識したパターンを基準パターンと 比較し、認識したパターンからエレベータ制御のための 10 シャフト情報項目を発生することを特徴とする方法。

【請求項2】 明るい中心(HM)を有する少なくとも 1 つの明るい領域 (HB) と、暗い中心 (DM) を有す る少なくとも1つの暗い領域 (DB) とをパターン内で 認識し、暗い中心(DM)の間隔から、エレベータ・ケ ージ(6)の位置をそれから誘導できるパターン繰り返 し距離 (MW) を確認することを特徴とする請求項1に 記載の方法。

【請求項3】 明るい中心 (HM) と暗い中心 (DM) との一様性を試験し、等しい輝度値を持つイメージ要素 20 (19)の百分率を確認し、ある百分率に対してパター ンを無効であると認識することを特徴とする請求項2に 記載の方法。

【詰求項4】 最後に確認したパターンに対する実際の パターンの変位を計算し、エレベータ・ケージ(6)の 速度 (v) を変位と走査サイクル時間(1x) から計算 することを特徴とする請求項1に記載の方法。

【請求項5】 到速領域 (B:) と再調整領域 (B:) とを少なくと4.1つのパターンから認識し、それらの領 域において、停止点に進入するエレベータ・ケージ (6) におけるドア接点 (17) の接続が許されること を特徴とする請求項目に記載の方法。

【請求項6】 エレベータ・ケージ(6)の速度を領域 (B. 、B.) に対応する速度と比較し、その比較から 到達条件と再調整条件を得ることを特徴とする請求項4 または5に記載の方法。

【詰求項7】 エレベータ・シャフト (1) の中に配置 された読取り可能な符号(3)と、エレベータ・シャフ ト (1) の内部を動くことができるエレベータ・ケージ (6) に配置された符号(3)を読取るための装置と、 符号(3)に含まれる、エレベータを制御するシャフト 情報項目を評価する装置とから構成され、符号(3)を 画像ごとに読取るための少なくとも1つのセンサ(1 0.12,2) が設けられ、符号(3) の読取った画像 に 含まれる少なくと4.1 つのパターンを認識するための 少なくとも1つの装置(MER)が設けられ、パターン に含まれているシャフト情報項目を評価するための少な くとも、1 つの計算装置 (CPU, ROM, RAM、BU S. INF) が設けられることを特徴とする請求項1に 記載の方法を実施する装置。

【請求項8】 第1のチャネル (13) が、センサ・1 0、12、2) と、計算装置 (CPU、ROM、RA M、BUS、INF)と、ドア接点(17)の接続のた めのリレーを有しパターン (EBE, EBN, ENE, ENNに依存する信号を評価するための論理リレー装 置(REL)とを備え、第2のチャネル(15)が、セ ンサ (10. 12. 2) と、計算装置 (CPU, RO M. RAM、BUS、INF)と、ドア接点(17)の 接続のためのリレーを有しパターン(EBE、EBN、 ENE、ENN) に依存する信号を評価するための論理 リレー装置 (REL) とを備え、チャネル (13、1 5) のパターンから発生された位置信号 (POS) を比 較するための位置比較器 (POC) とチャネル (13.

15) のパターンから発生された速度信号 (SPE) を 比較するための速度比較器 (SPC) とが比較器 (1 4) に設けられ、信号偏差が許されないものである場合 に比較器 (14) の誤差収集器 (FES) によって誤差 信号 (FEP、FEG) が取られ、ドア接点 (17) の 接続のために誤差収集器(FES)の障害信号(RE (1) がチャネル(13、15)の論理リレー装置(RE)

 を閉じることを特徴とする請求項7に記載の装置。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、エレベータ・シャ フトの内部を動くことができるエレベータ・ケージと、 エレベータ・シャフトの内部に配置されている読取り可 能な符号とを有するエレベータ・シャフトの、エレベー タを制御する、シャフト情報データを発生する方法およ び装置に関するものである。

30 [0002]

【従来の技術】符号化されたテープがエレベータ・シャ フトの高さにわたって配置されている。エレベータ・シ ャフトを有するエレベータが米国特許第4433756 号から知られるようになってきた。符号はテープの2つ のトラックに設けられた孔で構成される。エレベータ・ シャフトの内部を動くことができるエレベータ・ケージ に送光器とオプトエレクトロニック受光器が配置され る。符号化されているテープが、送光器と受光器の間を 延び、送光器の光ビームがテープの孔を通ってオプトエ レクトロニック受光器に到達するか、あるいはテープに よって遮断される。したがって、エレベータ・ケージの 位置についての2進符号化された情報がエレベータ・ケ ージの動きにつれて生ずる。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】既知の装置の欠点は、 エレベータ・シャフトの長手方向の伸びのためにエレベ ータ・ケージの位置が不正確になり、それによって符号 化されたテープの長手方向の位置が不正確になることで ある。別の欠点は、テープをエレベータ・シャフトに固 50 定するために大きな努力を必要とすることである。誤っ

た情報が生じないようにするためには、テープをエレベ ータ・シャフトの高さ全体にわたって正確に支持しなけ

ればならない。それを超えると、エレベータ・ケージの 誘導の不正確さのためにシャフト情報の信頼性が悪影響 を受けることがある。 野知の装置の別の欠点は、符号化 されているテープがシャフトの壁から離れて、シャフト の空間内部に突き出ることである。シャフトの横断面の 寸法をそれに応じて大きくしなければならない。安全を 確保することに関する別の欠点は、送光器または受光器 に欠陥があるのか、それとも光ビームが符号化されてい 10

るテープによって遮断されているのかを区別できないこ とにある。すなわち、障害の場合を正常な機能から区別

できない。 [0004]

【課題を解決するための手段】本発明はそれらの欠点を 解消するものである。特許請求の範囲で特徴づけられる 発明は、既知の装置の諸欠点を解消し、発生されるシャ フト情報の信頼度を向上する装置を提供する。

【0005】本発明によって達成される利点は、実質的 にシャフト情報の信頼性の向上によってエレベータの安 20 全性を確保できることにある。損傷を受けた部品または 欠陥のある部品によって発生された誤シャフト情報が本 発明の実施例によって認識され、その誤情報によって誤 った結果がもたらされることはない。たとえば、このた めに必要なシャフト情報が誤っている場合には、停止場 所へ動いているエレベータ・ケージでドア接点の接続

(bridging-over) が起こらない。別の利 点は、いくつかの機能、たとえば位置の監視、速度の監 棋、ドア同路の接続にあり、同じ装置および同じシャフ ト情報で自己診断を行うことができる。それによって、 固有の安全性に対する要件が満たされる。

[0006]

【発明の実施の形態】以下、シャフト情報データによる ドア接点の接続について、実施例によって本発明をさら に詳しく説明する。エレベータ・ケージが停止位置へ向 かって動いている間(進入時)は、時間を節約するた め、階ドアとケージ・ドアを早めに開く。したがって、 エレベータ制御の安全回路に設けられているドア接点 は、シャフト情報データに応じて安全装置によって接続 しなければならない。ドアが開かれる時に、ケーブルの 40 伸びのために下がるエレベータ・ケージをリセットする 場合にも、同じである。

【0007】エレベータ・ケージの進入時およびリセッ ト時に、ドア接点の接続が本発明の安全装置によって許 され、かつそれを監視しなければならない領域は、図1 から明らかである。エレベータ・ケージの停止場所の上 の位置+Pと、停止場所の下の位置-Pとを図の垂直軸 上に示す。位置P。においては、エレベータ・ケージの しきい値は停止場所と同じ高さにある。速度を水平軸上 速度をそれぞれ+P。、-P。およびv。で示す。接続 されたドア接点によるリセットが許される位置および速 度をそれぞれ! Pr 、 Pr および vr で示す。

【0008】図2は、停止場所の反射板2を備える領域 内のエレベータ・シャフト1を示す。 反射板の上に符号 3、たとえば、2ゾーン符号、一次元または二次元バー コード、またはポイントコードが配置される。この実施 例では、2ゾーン符号3を使用する。符号3は第1のト ラック4と第2のトラック5に配置される。この実施例 ではトラック4と5のパターンは同一であるが、異なっ てもよい。停止場所の高さを1点鎖線目。で示す。この 1点鎖線に関して符号3は対称的である。ドア接点の接 統が許される領域である進入領域Bには高さ線H。の半 分上および半分下にある、接続されたドア接点によって ドアが開かれている場合に、ケーブルの伸びのために下 がるエレベータ・ケージ6のリセットが許されるリセッ ト領域 B。 は半分は高さ線H. の上、半分は下にある。 第1のトラック4と第2のトラック5に配置されている 符号3は、エレベータ・ケージ6に設けられている2チ ャネル評価器7によって検出され、評価される。両方の チャネルは同一である。評価器7の第1の送光器8が反 射板2の第1のトラック4を照明し、評価器7の第2の 送光器9が反射板2の第2のトラック5を照明する。第 1のトラック4の照明された表面が評価器7の第1の電 荷結合素子センサ10の表面に像を結び、第2のトラッ ク5の照明された表面が評価器7の第2の電荷結合素子 センサ11の表面に像を結ぶ。送光器8の光学器12. 1 (図3) と重荷結合素子センサ10の光学器12.2 は相互に一致しているために、反射板2の照明された表 30 mは、たとえば10~30mmのある間隔をおいて電荷 結合素子センサ上に焦点を結ぶ。第2の送光器9の光学 装置と第2の電荷結合素子センサ11の光学装置におい ても、同様である。

【0009】図3は図2に示す評価器7のプロック回路 図を示す。この評価器7は第1のチャネル13と、比較 器14と、第2のチャネル15とを有する。第2のチャ ネル15は第1のチャネル13と同じ構成であるので、 図示は省略した。第1のチャネル13は光学器12.1 を持つ第1の送光器8と、光学器12、2を持つ電荷結 合素子センサ10と、パターン認識論理装置MERと、 インタフェースINFと、コンピュータCPUと、リレ 一論理装置RELとから構成される。CPUはパスシス テムBUSによってプログラムおよびパラメータ記憶装 網ROMと、データ記憶装置RAMと、パターン認識論 理装置MERと、インタフェースINFとに接続され る。リレー論理装置RELにはリレー16が接続され る。進入のための条件またはリセットのための条件が満 たされる場合には、リレー16は安全回路18のドア接 点17を接続する。チャネル13と15の動作結果が比 にvで示す。進入中にドア接点の接続が許される位置と 50 較器 1 4 で比較され、許されない逸脱の場合には誤差が 発生される。比較器14は位置比較器POCと、速度比 較器SPCと、誤差収集器FESとから構成される、エ レベータ制御の第1の解除信号ENEによって、エレベ ータ・ケージの准人時にドアを開くことができ、エレベ - 夕制御の第2の解除信号ENNによって、ドアが開い ているエレベータ・ケージ6をリセットできる。解除信 号ENEとENNは評価器7自体によって発生すること もできる。その理由は、このために必要な情報が存在す るからである。進入領域 B。に入った時に第1の解除信 号ENEが発生される。リセット領域B, に入った時に 10 第2の解除信号ENNが発生される。それらの領域を出 ると解除信号ENEとENNはリセットされる。

【0010】インタフェースINFから出た位置信号を 紀号POSで示し、インタフェースINFから出た速度 信号を記号SPEで示す。位置比較器POCで許されな い逸脱が検出されると、第1の誤差信号FEPが誤差集 種器 FESに供給され、速度比較器 SPCで許されない 逸脱が検出されると、第2の誤差信号FEGが誤差集積 器FESに供給される。進入条件が満たされた時にイン タフェースINFが進入信号EBEを発生し、リセット 20 条件が満たされた時にインタフェースINFがリセット 信号 EBNを発生する。リレー論理装置 RELに第1の 解除信号 FN Fと進入信号 FB Fが同時に存在する場合 にのみ または第2の解除信号ENNとリセット信号E B N が同時に存在する場合にのみ、ドア接点の接続が行 われる。リレー論理装置RELの乱れが第3の誤差信号 REFを生ずる。誤差集積器FESに誤差が存在する場 合には、第4の謝差信号RELがリレー論理システムR E L によってリレー 16を切り替える。

をフィールドから電荷に変換するイメージ要素19から 構成され、反射板2に配置されている符号3の画像を検 出する。図4はその画像の詳細を示す。その画像には明 るい領域IIBと、暗い領域DBと、明るい中心IIMと、 暗い中心DMとを有するあるパターンが含まれている。 図5が示すように、電荷結合素子センサ10、11の画 像をパターン認識論理装置MERとコンピュータCPU によって定期的に分析し、ハードウェアはくり返し試験 を行う。プログラムがステップSO、0で評価装置7の 雷源雷圧のスイッチオンによって開始される。ステップ 40 S 0. 1では、ハードウェアとソフトウェアの初期化を 行う。それに続いてステップS0、2で、記憶装置RA Mと ROMと、レジスタ等の試験をハードウェアで行 う。この試験結果に合格したら、ステップS1ないしS 13を含むエンドレスループを循環する。このエンドレ スループはほぼ一定の進行時間を持つ。時間制御への 「割り込み:は許されない」その理由は、評価装置7の 場合には安全に関する装置が関連するためである。ステ ップS1のパターンを持つ検出された画像が、不明確で ない明るい領域HBと暗い領域DBを表示する場合に

は、明るい領域HBと暗い領域DBの長さ、および暗い 中心DMによって決定されるパターン繰り返し距離MW の長さを検査する。それを超えると、同じ輝度値を持つ 画素19の百分率を確認することによって、明るい中心 HMと暗い中心DMの一様性を検査する。更に処理する ために、パターン認識論理装置MERによって確認した データを、パスシステムBUSによってデータ記憶装置 RAMに送る..

【0012】ステップS2では、比較器CPUが、確認

されたパターンを、プログラムおよびパラメータ記憶装

置ROMにファイルされている基準パターンと比較す る。安全の理由から、ステップS3で明るい中心HMと 暗い中心DMの一様性も判定する。同じ輝度値を持つ画 素19の百分率が低すぎると、進入条件とリセット条件 が満たされない。判断ステップS1ないしS3の判定結 果が否定であると、進入条件とリセット条件がインタフ ェースINFによって満たされないものと見なされる。 ステップS4では、確認された実際のパターンを最後に 確認されたパターンと比較し、それから確認パターンの 変位を計算する。ステップS5では、エレベータ・ケー ジ6の瞬時速度 v を変位と走査サイクル時間 t , から計 算する。ステップS6では、リセット領域Baからのパ ターンが検出されたかどうかを判定する。このステップ S6の判定結果が肯定であると、ステップS7で瞬時ケ ジ速度 v をエレベータ・ケージ6をリセットするため に許されている速度 v. と比較する。ステップS7での 判定結果が肯定であると、ステップS8が始まる。ステ ップS8では、進入およびリセットが許されていること がインタフェースINFに通知される。ステップS9で 【0011】電荷結合素子センサ10と11は、入射光 30 は進入信号EBEとリセット信号EBNをリレー論理装 置RELへ送る。ステップS6とS7における判定結果 が否定であると、ステップS10が始まる。ステップS 10では瞬時ケージ速度 v を、エレベータ・ケージ 6の 進入に許されている速度v.と比較する。ステップSI ①での判定結果が否定であると、進人条件がインタフェ 一スINFによって満たされないものと見なされる、ス テップS10での判定結果が肯定であると、ステップS 11が始まる。このステップでは進入が許されているこ とがインタフェースINFに通知される。そのインタフ ェースはステップS9で進入信号EBEをリレー論理装 置RELに供給する。進入信号EBE、またはリセット 信号 F.B.N と第1の解除信号 E.N.E.、あるいは第2の解 除信号ENNと誤り無し信号REOが存在する場合に は、リレー16はオンになり、ドア接点17が接続され 【0013】エレベータ・ケージ6の位置の計算は図5

の流れ図には示していない。その計算は、第1の検出し たパターンと、計算したパターン繰り返し距離MWとに 基づいて容易に得ることができる。それから得た位置信 50 号POSは、第2のチャネルの位置信号と比較するばか

7 りでなく、進入中にエレベータ・ケージの位置を精密に 決定するためエレベータ制御に使用することもできる 【0014】ステップS12で行う、記憶装置RAM と、ROMと、レジスタ等のハードウェアについての試 験を完全に行うには長い時間を要する。ステップS1な いしS13で構成されているエンドレスループを短い一 定の時間で行うために、ハードウェアについての試験を 持続時間の等しい試験部分に分割する。図6は6つの判 定部分ASI~AS6を持つ例を示す。ポインタZEI として示す変数が実際の判定部分AS2を指す このル 10 る ープを循環している間に、実際の判定部分が判定された 後でポインタZEIが次の部分にセットされて、ループ の次の循環中に別の判定部分が判定されるようにする。 この例では、全体の判定をループを6回順次循環して行 った。ステップS13ではその場合に確認されたデータ がインタフェースINFを通じて位置比較器POCと速 度比較器SPCへ供給される。

【図面の簡単な説明】

【図1】ケージ位置をケージ速度の関数として示す線図*

*である。

【図2】軸データ情報を発生するための本発明の装置を 示す図である。

【図3】軸情報データを評価するための装置を示す図である。

のる。 【図 4】符号の検出した画像の詳細を示す図である

【図5】軸情報データの評価の制御のため、および定期

的な自己監視のためのアルゴリズムの流れ図である。 【図6】長いハードウェア判定の分割を示す略図であっ

【符号の説明】

- 1 エレベータ・シャフト
- 2 反射板 3 符号
- 4、5 トラック
- 6 エレベータ・ケージ
- 7 評価器
- 8、9 送光器
- 10、11 電荷結合素子センサ

